

令和 9 年度（2027 年度）入学者選抜における入試科目方法等の変更について（予告）

工学部電子システム工学科の一般選抜試験における大学入学共通テストおよび個別学力検査等の配点については次のとおりです。

工学部電子システム工学科の一般選抜試験前期日程の個別学力検査の変更については、令和 6 年12月25日に公表しているところですが、「令和 9 年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テストの出題教科・科目の出題方法等」の公表に伴い配点にかかる変更点を公表します。

【変更前】 令和 8 年度 工学部 電子システム工学科 一般選抜 前期日程

大学入学共通テストの利用教科・科目名			個 別 学 力 検 査 等		大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等									
教科	科 目 名 等		教科等	科 目 名 等	試験の区分	国語	地歴公民	数学	理科	外国語	情報	小論文	配点合計	
国 地歴 公民 数 理 外 情	「国」 「地総,地探」,「歴総,日探」,「歴総,世探」,「地総/歴総/公」, 「公,倫」,「公,政・経」 から 1		数 理	「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B・数学C」 <u>「物理基礎・物理」</u>	大学入学共通テスト	100	100	200	200	200	100		900	
	「数Ⅰ,数A」 と 「数Ⅱ,数B,数C」				個別学力検査等				200	<u>200</u>				400
	「物」 と 「化」 「英」 「情報Ⅰ」 [6 教科 8 科目]				計	100	100	400	400	200	100			1,300

共通テスト英語配点内訳	
リーディング	リスニング
160	40

共通テスト英語配点内訳	
リーディング	リスニング
160	40



【変更後】 令和 9 年度 工学部 電子システム工学科 一般選抜 前期日程

大学入学共通テストの利用教科・科目名			個 別 学 力 検 査 等		大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等								
教科	科 目 名 等		教科等	科 目 名 等	試験の区分	国語	地歴公民	数学	理科	外国語	情報	小論文	配点合計
国 地歴 公民 数 理 外 情	「国」 「地総,地探」,「歴総,日探」,「歴総,世探」,「地総/歴総/公」, 「公,倫」,「公,政・経」 から 1		数	「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B・数学C」	大学入学共通テスト	100	100	200	400	200	100		1,100
	「数Ⅰ,数A」 と 「数Ⅱ,数B,数C」				個別学力検査等				200				200
	「物」 と 「化」 「英」 「情報Ⅰ」 [6 教科 8 科目]				計	100	100	400	400	200	100		1,300

共通テスト英語配点内訳	
リーディング	リスニング
160	40

共通テスト理科配点内訳	
物理	化学
300	100

共通テスト英語配点内訳	
リーディング	リスニング
160	40

共通テスト理科配点内訳	
物理	化学
300	100